



光子学报 » 2013, Vol. 42 » Issue (7): 797-800 DOI: 10.3788/gzxb20134207.0797

[光电子学与光电子器件](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

基于像散法的线阵CCD相机检焦技术

王智

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 长春 130033

Inspection Focus Technology Based on Astigmatic Method for Linear CCD Camera

WANG Zhi

Changchun Institute of Optics, fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献 \(10\)](#)

[相关文章 \(11\)](#)